文章编号: 0258-7025(2010)04-1028-05

高精度双折射可控保偏光纤光栅研究

裴 丽 赵瑞峰 宁提纲 祁春慧 李卓轩 高 嵩

(北京交通大学全光网络与现代通信网教育部重点实验室,北京 100044)

摘要 自主研制了大长度光纤轴向研磨厚度精确控制装置和电弧放电光纤研磨截面高精度抛光装置。研磨精度达0.01 μm,研磨长度可大于100 mm,且能实现多光纤同时轴向研磨。利用该装置可精确控制保偏光纤光栅(PMF-FBG)侧面研磨厚度,从而实现大长度高精度双折射可控保偏光纤光栅的制作,保偏光纤光栅两个反射峰的间距可以通过研磨量精确控制。实验表明,研磨保偏光纤的一侧外包层半径由125 μm到65 μm,保偏光纤光栅两个反射峰的间距由0.34 nm改变为0.208 nm。

关键词 光通信;可控双折射;光纤侧面研磨;保偏光纤光栅

中图分类号 TN929.1 文献标识码 A doi: 10.3788/CJL20103704.1028

Controllable Birefringent Polarization-Maintaining Fiber Bragg Grating with High Precision

Pei Li Zhao Ruifeng Ning Tigang Qi Chunhui Li Zhuoxuan Gao Song

(Key Laboratory of All Optical Network & Advanced Telecommunication Network, Ministry of Education, Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China)

Abstract An optical fiber long length side-grinding device with controllable and high precision grinding thickness, and a setup for high-precision polishing of the optical fiber section by using an arc discharge method are self-made. The grinding precision is 0.01 μ m, the grinding length can be longer than 100 mm, and multi-fibers can be grinded at the same time. By using the devices, the side grinding thickness of the polarization-maintaining fiber Bragg grating (PMF-FBG) can be controlled, and long length, high precision controllable PMF-FBG can be fabricated. The span of the two wavelengths of the PMF-FBG can be controlled accurately. The experiment results show that when the radius of the grinding side of the PMF-FBG changed from 125 μ m to 65 μ m, the wavelength span of the PMF-FBG changed from 0.34 nm to 0.208 nm.

Key words optical communications; controllable birefringence; optical fiber side-grinding; polarization-maintaining optical fiber grating

1 引 言

自从 1987 年 G. Meltz 等实现了光纤 Bragg 光 栅的紫外光侧面写入技术以后,许多研究机构对光 纤光栅产生了极大的兴趣。目前,光纤光栅在光纤 激光器、光纤滤波器、光纤传感、光上下话路等领域 正在发挥越来越大的作用^[1~5]。

保偏光纤具有高双折射率,由于其对两个正交的偏振光具有较强的偏振保持能力,并且与普通单

模光纤有良好的相容性而在光纤通信和光纤传感系统中得到越来越广泛的应用。其传输模为两个偏振 方向互相垂直的基模 HE_{11x}和 HE_{11y},传输常数分别 为β_x和β_y。在保偏光纤中写入光纤光栅,等效于在 两个主轴上分别写入一个光纤光栅,因此可以直接 获得双波长单偏振光纤光栅。形状双折射是获得保 偏光纤的有效方法之一,为了灵活实现双折射程度 的调整,光纤侧面不同厚度的研磨是一种行之有效

作者简介:裴 丽(1970—),女,教授,博士生导师,主要从事光纤通信、光纤传感、光纤无线通信、光网络和光器件方面的研究。E-mail:lipei@bjtu.edu.cn

收稿日期:2009-05-22; 收到修改稿日期:2009-07-24

基金项目:国家自然科学基金(60771008,60837002)、北京市自然科学基金(4082024)、留学回国人员基金(教外 2008890) 和教育部博士点基金(20080040002)资助课题。

的方法。目前的光纤研磨技术主要存在3个问题: 1) 光纤研磨长度的限制。虽然光纤的端面研磨,以 及短距离光纤轴向研磨在最近几年取得了较大的发 展,但是对于长度大于100 mm光纤的轴向研磨至今 仍是一个技术难点,国内外未见相关加工的报道。 人工研磨虽然有可能加大光纤的研磨长度,但是对 研磨人员的技术水平有较高要求,而且耗时较长,水 气等外界因素对研磨后光纤的性能影响巨大,容易 造成很大的器件损耗。2)研磨厚度的检测。目前 采用的测厚仪价格十分昂贵(国外产品价格高达数 万美元以上),而且由于光纤自身的特点(直径仅 125 um),要求光纤研磨的精度必须控制在微米量 级。此外光纤为圆形目透明,测厚难度较大,传统的 测厚仪很难达到要求。3)光纤研磨后的抛光质量。 国外利用低功率 CO₂ 激光光源对光纤端面进行抛 光加工,虽然其表面质量有所改善,但抛光后光纤端 面的表面粗糙度仍高达0.1 µm,插入损耗的最佳值 还高达1.45 dB,不能满足光纤通信发展的要求。

经过多年研究,本研究小组实现了光纤侧面研 磨厚度精确控制以及电弧放电光纤研磨截面高精度 抛光,并已申请专利。以此为基础,对140 mm长的 保偏光纤光栅(PMF-FBG)进行了侧面研磨抛光,光 纤光栅研磨厚度在0.01 μm的精度中调整,可以通 过研磨量的精确控制,获得反射波长间隔满足需求 的高精度双折射可控保偏光纤光栅,其在光栅传感 系统中能够有效克服光栅传感器的温度和应力交叉 敏感,成为一种理想的传感方案。利用保偏光纤上 写入的双波长单偏振光纤光栅,对于进一步制作波 长满足国际电信联盟(ITU-T)建议波长的偏振稳定 光纤激光器具有重要的意义^[6,7]。

2 理论分析

2.1 保偏光纤光栅光谱特性

当光敏光纤通过紫外激光时,光纤的折射率将 随光强的空间分布发生相应变化,如果使其内部折 射率呈现周期性分布,并保存下来,就成为光纤光 栅。布拉格光栅的基本特性就是它是以共振波长为 中心的一个光学滤波器,该共振波长称为布拉格波 长^[8~12],且

$$\lambda_{\rm B} = 2n_{\rm eff}\Lambda,\qquad(1)$$

式中 *n*_{eff}为光纤的有效折射率, Λ 为光纤布拉格光栅的周期。

保偏光纤中写入布拉格光纤光栅时,由于保偏 光纤在两个正交偏振轴上的折射率不同,写入光栅 存在两个反射峰,且两个反射峰之间的波长间距为 $\delta \lambda_{\rm B} = 2 | n_x - n_y | \Lambda,$ (2)

式中 n_x 和 n_y 分别为保偏光纤两个正交偏振轴x轴和y轴对应的有效折射率。

2.2 侧面研磨量变化对保偏光纤有效折射率的改变

光波导中模式的传输常数用 β 表示,工作光波 长为λ,保偏光纤侧面研磨之前,假设 x 轴和 y 轴方 向的有效折射率分别为 n_{x0} 和 n_{y0} ,随着研磨量的增 加, $|n_x - n_y|$ 的值随之改变,由(2)式可以看出光栅 两个反射峰之间的间距发生变化,通过高精度研磨 量的控制,可以实现保偏光纤光栅双波长间距的精 细调整。

实验中选择的保偏光纤为应力双折射保偏光 纤,几何形状为圆对称。为了简化计算,做如下近 似:光纤轴向研磨平面的法线方向为 y 轴方向,研 磨过程中,假设 x 轴方向没有应力和半径改变,则 忽略 n_x 的变化,只考虑研磨光纤包层变薄对 n_y 的影 响。初始状态,芯子折射率和半径为 n_{s0} 和 a_0 ,第一 包层折射率和半径为 n_2 和 a_2 ,第二包层为空气,折 射率为 1。光纤研磨后 a_2 变为 a'_2 ,且 $a'_2 < a_2$ 。

场分量 e_z , h_z 满足 Bessel 方程

 $\frac{d^{2}\psi}{dr^{2}} + \frac{1}{r} \frac{d\psi}{dr} + \left(k^{2} n_{i}^{2} - \beta^{2} - \frac{m^{2}}{r^{2}}\right), \quad \psi = 0, (3)$ $\vec{x} \oplus \psi = \psi(r) \ \mathcal{R} \neq e_{z} \ \vec{x} \ h_{z}, n_{i} = n_{y0}, n_{2}, 1, m = 0,$ $1, 2, 3, 4, \cdots$

根据在各个边界上 e_{φ} , h_{φ} , e_{z} 和 h_{z} 的连续条件,可以获得特征方程

$$\left| \overrightarrow{SA} \ \overrightarrow{KK} \right| = 0, \tag{4}$$

式中**K** = **p**₃₂, **S** = **p**₃₂ **p**₂₃ **p**₂₁ **p**₁₂, **p**₂₁ 与**p**₁₂ 分别 为 $r = a_1$ 时对应的 $e_{\varphi^2}, h_{\varphi^2}, e_{z^2}, h_{z^2}$ 以及 $e_{\varphi^1}, h_{\varphi^1}, e_{z_1}, h_{z_1}$ 满足的矩阵。**p**₃₂ 与**p**₂₃ 分别为 $r = a_2$ 时对应的 $e_{\varphi^3}, h_{\varphi^3}, e_{z^3}, h_{z^3}$ 以及 $e_{\varphi^2}, h_{\varphi^2}, e_{z^2}, h_{z^2}$ 满足的矩阵。通 过数值解法可以得到各个传输模式所对应的传输常 数,进一步获得研磨光纤包层后波导的有效折射率 为

$$n_{y}^{t} = \beta/(2\pi/\lambda).$$
 (5)

2.3 理论分析结果

选择保偏光纤的参数为: $n_{x0} = 1.4450, n_{y0} = 1.4447, 光栅周期为534 nm, 可得初始状态下光栅$ 双波长为

 $\lambda_{x0} = 1543.3 \text{ nm}, \quad \lambda_{y0} = 1542.9 \text{ nm},$

 $\delta \lambda_{\mathrm{B}} = 2 \left| n_{x0} - n_{y0} \right| \Lambda \approx 0.34 \, \mathrm{nm}$,

(5)和(2)式相结合,可得不同光纤侧面研磨量对应 保偏光纤光栅双波长间距变化情况的理论计算结





果,如图1所示。

由图 1 可见,随着光纤侧面研磨量的增加,保偏 光纤光栅双波长间距变小,且变化率约为 0.0020 nm/μm。

3 高精度双折射可控保偏光纤光栅的 制作

3.1 光纤侧面研磨厚度精确控制方法及装置

图 2 为自主研制的光纤侧面研磨厚度精确控制 装置,利用该装置实现高精度(0.01 μm)、大长度 (大于 100 mm)保偏光纤光栅的侧面研磨厚度精确 控制。



图 2 光纤轴向磨抛厚度精确控制装置 Fig. 2 Optical fiber side-grinding setup

本装置可实现以下功能:1)通过调节施加在压 电陶瓷(PZT)上的电压,改变待研磨保偏光纤光栅 与基准块的相对位置,不仅光纤光栅的研磨厚度可 自由调整,而且精度可达0.01 µm。2)保偏光纤光栅 的研磨长度由定位传感器精确控制,可以对长度为 140 mm的保偏光纤光栅进行轴向研磨。3)本装置 保偏光纤光栅放置于微晶玻璃上(热膨胀系数为 10⁻⁷/℃量级),有效避免了研磨过程中材料发热引 起的损耗。 3.2 电弧放电光纤研磨截面高精度抛光方法及装置

图 3 为自主研制的电弧放电光纤研磨截面高精 度抛光装置,该装置利用两电极间的放电电弧对研 磨后保偏光纤光栅表面进行抛光处理,以便去除保 偏光纤光栅研磨过程中产生的微裂损伤,提高研磨 光纤光栅的质量。



图 3 电弧放电光纤研磨截面高精度抛光装置

Fig. 3 Optical fiber section polishing with arc discharge

本装置可实现以下功能:1)采用电弧放电抛光 的方法,通过 PZT 调节研磨抛光后的保偏光纤光栅 与电极的相对位置,利用电弧放电所产生的高温将 研磨保偏光纤光栅的表面进行熔化,从而有效消除 研磨保偏光纤光栅表面的粗糙度,抑制微裂纹或凹 坑造成的较大损耗。2)通过精密导向机构和定位 传感器,使放电电极沿着研磨后待抛光保偏光纤光 栅的轴向移动,从而实现对保偏光纤光栅抛光的长



图 4 侧向研磨后的光纤 Fig. 4 Optical fiber after side-grinding



图 5 抛光前(a)后(b)的光纤研磨侧面 Fig. 5 Optical fiber section before (a) and after (b) polishing

度进行任意调节。3)利用电机速度控制器对电极 移动速度进行控制。

侧向研磨后的光纤如图 4 所示。研磨抛光前后 的光纤如图 5 所示。显微镜下观察可以看到抛光后 的保偏光纤光栅非常透明,抛光后的光纤光栅性能 稳定,基本上消除了光纤光栅表面微裂纹的影响。 4 实验结果

4.1 保偏光纤研磨后光纤光栅双波长的变化

利用图 2,3 所示的实验装置,对写入140 mm长 光纤光栅的保偏光纤侧面研磨和抛光,用 ANDO AQ6317 光谱仪测量保偏光纤光栅双波长的变化, 实验结果如图 6 所示。



图 6 实验结果 Fig. 6 Experimental results

实验测得不同光纤侧面研磨量对应保偏光纤光 栅双波长间距变化情况如图 7 所示。





由图 7 可见,随着光纤侧面研磨量的增加,保偏 光纤光栅双波长间距变小,且变化率约为 0.0022 nm/μm。

4.2 抛光前后保偏光纤光栅的光谱变化

侧面研磨后的光纤表面不可避免地会存在微裂

纹,这将导致其损耗随着时间的推移迅速加大,因此,必须对侧面研磨后的光纤表面进行抛光。采用图3所示装置对侧面研磨的光纤进行抛光,光谱仪测量侧面研磨保偏光纤光栅抛光前后的光谱如图8 所示。

4.3 实验结果分析

由图 6 可见,随着保偏光纤轴向研磨量的增加, 保偏光纤光栅双波长间距逐渐变小,这是由于研磨 量增加,光纤包层沿 y 轴变薄,对应的有效折射率 n_y增加,两个正交偏振轴的有效折射率差变小所致。 比较图 1 和图 7 的结果,发现不同光纤侧面研磨量 对应保偏光纤光栅双波长间距变化率基本一致,光 纤侧面研磨量较小时,理论分析结果和实验结果基 本吻合,随着光纤侧面研磨量的增加,理论分析结果 软大。其原因是理论分析时,近似认为 n_x保持不 变,而在实际光纤研磨过程中,研磨量较小时,n_x相 对稳定,而当研磨量增大后,n_x会发生改变,导致保 偏光纤光栅的双波长位置都会变化。图 6 中保偏光 纤双波长位置的变化与上述分析一致。





图 8 侧面研磨保偏光纤光栅抛光前后的光谱。(a) 抛光前;(b) 抛光后

Fig. 8 Optical spectrum of PMF-FBG before and after polishing. (a) before polishing; (b) after polishing

由图 8 可见,抛光前后保偏光纤光栅的光谱基 本稳定,因为电弧放电光纤研磨截面高精度抛光装 置中的电弧虽然含有紫外光,但是本抛光装置电弧 距离侧面研磨光纤的表面还有一定距离,其抛光主 要是利用电弧放热使得光纤表面热熔化消除了微裂 纹,光纤芯子基本不受影响。此外,由于表面微裂纹 的消除,光纤光栅的透射谱深度还略有改善。

5 结 论

许多高精度光纤器件制造过程中的一道关键工 序就是光纤端面或光纤轴向的研磨,经过多年研究, 本研究小组实现了光纤侧面研磨厚度精确控制以及 电弧放电光纤研磨截面高精度抛光,并以此为基础, 对保偏光纤光栅进行了侧面研磨抛光,光纤光栅研 磨厚度在0.01 μm的精度中调整,通过研磨量的精 确控制,可获得高精度双折射可控保偏光纤光栅。 实验结果表明本方案切实可行。

参考文献

- Zhu Yingxun, Wang Rong, Ding Xiaoguang *et al.*. Using a step-sampling-chirped grating to realize spectral-phase en/ decoding [J]. *Chinese J. Lasers*, 2008, **35**(12):1888~1893 朱英勋,王 荣,丁晓光等. 用分段采样啁啾光栅实现谱相位 编码[J]. 中国激光, 2008, **35**(12):1888~1893
- 2 Kenneth O. Hill, Gerald Meltz. Fiber Bragg grating technology fundamentals and overview [J]. J. Lightwave Technol., 1997, 15(8):1263~1275
- 3 Y. Gong, X. Liu, L. Wang *et al.*. Optimal design of multichannel fiber Bragg grating filters with small dispersion and low index modulation [J]. *J. Lightwave Technol.*, 2009, 27(15):3235~3240
- 4 Xu Lingling, Jin Long, Kai Guiyun et al.. Switchable dual-

wavelength erbium-doped fiber laser with a tilted fiber Bragg grating [J]. Acta Optica Sinica, 2007, **27**(9):1658~1662 徐玲玲,金 龙,开桂云 等.利用倾斜光纤光栅的可开关双波 长光纤激光器[J]. 光学学报, 2007, **27**(9):1658~1662

5 Wei Ting, Qiao Xueguang, Jia Zhen'an et al.. Temperatureinsensitive fiber Bragg grating pressure sensing with plane round metal diaphragm [J]. Acta Optica Sinica, 2007, 27(1): 80~84

尉 婷,乔学光,贾振安等.平面圆形膜片式光纤布拉格光栅 温度补偿压强传感[J].光学学报,2007,27(1):80~84

- 6 Ning Tigang, Pei Li, Hu Xudong *et al.*. Dual-wavelength of single polarized fiber laser based on common active fiber [J]. *Chinese J. Lasers*, 2008, 35(12):1868~1871
 宁提纲,裴 丽,胡旭东 等. 单偏振双波长非保偏有源掺杂光 纤激光器[J]. 中国激光, 2008, 35(12):1868~1871
- 7 S. Matsumoto, M. Takabayashi, K. Yoshiara *et al.*. Tunable dispersion slope compensator with a chirped fiber grating and a divided thin-film heater for 160-Gb/s RZ transmissions [J]. *IEEE Photon. Technol. Lett.*, 2004, **24**(7):902~906
- 8 Pei Li, Jian Shuisheng, Yan Fengping *et al.*. The dispersion compensation of optical fiber Bragg grating on the long-distance G. 652 fiber transmission system [J]. Acta Optica Sinica, 2004, 24(2):220~224

裴 丽,简水生,延凤平 等. 普通单模光纤传输系统的光纤光 栅色散补偿研究[J]. 光学学报, 2004, **24**(2):220~224

- 9 A. S. Paterno, V. de Oliveira, T. S. Figueredo *et al.*. Multiplexed fiber Bragg grating interrogation system using a modulated fiber Bragg grating and the tunable-filter method [J]. *IEEE Sensors Journal*, 2006, 6(6):1662~1668
- 10 Xiao Wang, Qihua Zhu, Yanlei Zuo *et al.*. Matched wavelength and incident angle for the diagnostic beam to achieve coherent grating tiling [J]. *Chin. Opt. Lett.*, 2008, 6(4):241~243
- Jia Weiguo, Shi Peiming, Yang Xingyu et al.. Modulation instability of fiber Bragg gratings with raised cosine apodization [J]. Chinese J. Lasers, 2007, 34(7):930~934 贾维国,史培明,杨性愉等. 升余弦变迹布拉格光纤光栅中的 调制不稳定性[J]. 中国激光, 2007, 34(7):930~934
- 12 Liu Qiuping, He Xingdao, Zhang Aiyun *et al.*. Linear solution for coupled-wave equation of nonlinear recording grating [J]. *Acta Optica Sinica*, 2007, 27(6):977~980 刘秋平,何兴道,张霭云 等. 线性化求解非线性记录光栅耦合 波方程[J]. 光学学报, 2007, 27(6):977~980